

xCaTiO₃-yMgTiO₃-z(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃의 소결특성과 마이크로파 유전특성

심 화 섭, 김 덕 환, 임 상 규, 안 철
 서강대학교 전자공학과
 서울시 마포구 신수동 1. (121-742)
 e-mail : s297032@ccs.sogang.ac.kr

The Sintering Properties and Microwave Dielectric Characteristics of xCaTiO₃ - yMgTiO₃- z(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃

Hwa-Sup Sim, Duck-Whan Kim, Sang-Kyu Lim, Chul An
 Department of Electronic Engineering, Sogang University
 1 Sinsoo-Dong, Mapo-Gu, Seoul, Korea
 e-mail : s297032@ccs.sogang.ac.kr

Abstract

The microwave dielectric properties and sintering properties of the xCaTiO₃-yMgTiO₃-z(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃ systems were investigated for the development of microwave dielectric materials. Dielectric constants decreased with increasing the amounts of MgTiO₃ and increased with reducing (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃ contents. On the other hand Q*f values increased. τ_f changed from positive to negative value with increasing MgTiO₃ or (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃ contents. The microscopic structures were mixed phase with a little second phase. We found some compositions with $\tau_f \approx 0 \text{ ppm}/\text{°C}$. These compositions exhibited the stable dielectric properties on the various sintering temperatures.

I. 서 론

마이크로파 대역에서 통신 시스템을 구성하는 중요 부품인 Duplexer, 대역통과 필터, 발진기등에 유전체 공진기를 사용함으로써 기기의 소형화, 고성능화, 저가격화를 도모할 수 있게 되었다는 것은 이미 널리 알려진 일이며

이를 위해 마이크로파 유전체에 요구되는 특성은 높은 유전상수(ϵ_r)와 적은 유전손실, 그리고 공진주파수의 온도계수(τ_f)가 0 ppm/°C에 가까운 값을 가져야 한다는 것이다. 특히 유전상수는 부품의 소형화에 직접적으로 영향을 미치는 요인이며, 요즈음과 같이 더욱 소형화된 부품 개발을 위해서는 보다 높은 유전상수를 지닌 재료가 요구되고 있다.

그러나 일반적으로 유전율이 큰 물질은 Cockbain과 Harrop이 지적한 대로 공진주파수의 온도계수(τ_f)가 큰 값을 갖기 때문에^[1] 높은 유전율과 적은 유전손실을 갖는 동시에 공진 주파수의 온도계수가 0 ppm/°C인 단일상의 유전체를 개발하는 것은 매우 어렵다. 그러므로 이를 위해 공진주파수의 온도계수가 양(+)인 물질과 음(-)인 물질을 이용하여 새로운 고용체(solid solution)를 형성하거나 혼합상(mixed phase)을 이루게 하는 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 근래에는 이차상(secondary phase)을 이용한 연구도 행해지고 있다.^{[2][3]}

따라서 본 논문에서는 비교적 높은 유전율을 지니고 공진주파수의 온도계수가 양(+)인 CaTiO₃ ($\epsilon_r=170$, $Q \cdot f = 6000 \text{ GHz}$, $\tau_f = +800 \text{ ppm}/\text{°C}$)^[4]와 공진주파수의 온도계수가 음(-)인 (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃ ($\epsilon_r=80$, $Q \cdot f=2000 \text{ GHz}$, $\tau_f = -274 \text{ ppm}/\text{°C}$)^[5] 및 높은 $Q \cdot f$ 값을 지닌

$MgTiO_3$ ($\epsilon_r=17$, $Q \cdot f = 120,000$ GHz, $\tau_f=-45$ ppm / $^{\circ}C$)^[4]를 혼합하여 70 이상의 고유전율과 적은 유전손실 및 공진주파수의 온도계수가 0 ppm/ $^{\circ}C$ 에 가까운 마이크로파 유전체를 얻고자 하였다.

II. 실험 방법

본 실험에 사용된 시약은 모두 99% 이상의 고순도 시약으로 Li_2CO_3 , Nd_2O_3 , TiO_2 , $MgTiO_3$ 및 $CaTiO_3$ 를 사용하였고, 일반적인 세라믹 제조 공정에 따라 시편을 제조하였다.

먼저 Li_2CO_3 , Nd_2O_3 , TiO_2 를 혼합·하소하여 $(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO_3$ 를 제조한 후, 이를 $MgTiO_3$ 및 $CaTiO_3$ 와 x, y, z의 조성비에 따라 정확히 평량하여 20시간 동안 습식 혼합과 분쇄하였고, 건조된 분말을 1000~1100 $^{\circ}C$ 에서 3시간 동안 하소하였다. 최종 시편은 준비된 분말을 원통형 시편으로 등압 성형한 후 1250~1400 $^{\circ}C$ 에서 2시간 동안 소결되었다.

소결된 시편들은 결정상의 생성 및 2차상 물질의 존재 여부를 관찰하기 위하여 XRD 분석을 하였으며, 마이크로파 유전 특성의 측정은 Hakki와 Coleman에 의해 제시되고 Cottney에 의해 수정·보완된 dielectric rod resonator method에 의해 측정되었다.^{[6][7]}

III. 실험 결과

3.1 $MgTiO_3$ 양에 따른 유전특성

그림 1은 1350 $^{\circ}C$ 에서 2시간 동안 소결된 시편들의 $MgTiO_3$ 양에 대한 각 유전 특성의 변화를 보인 것이다. 그림 1(a)는 유전 상수의 변화를 나타낸 것으로, 유전 상수는 $MgTiO_3$ 의 양이 증가하고 $(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO_3$ 의 양이 감소함에 따라 점차 감소한다. 이는 $(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO_3$ 가 일정한 경우, 세 혼합물을 중 가장 큰 유전 상수($\epsilon_r=170$)를 갖는 $CaTiO_3$ 의 양이 $MgTiO_3$ 의 증가와 함께 감소하기 때문이다.

그림 1(b)는 $MgTiO_3$ 양의 변화에 대한 $Q \cdot f$ 값의 변화를 나타낸 것으로, 비교적 낮은 $Q \cdot f$ 값을 갖는 $(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO_3$ 양이 감소하고, 높은 $Q \cdot f$ 값을 갖는 $MgTiO_3$ 양이 증가함에 따라 점차 증가하는 것을 볼 수 있다. 그림 1(a)와 (b)를 통하여 유전상수 및 $Q \cdot f$ 값이 비교적 선형적으로 변화하는 것으로 보아, 새로운 고용체나 이차상 등에 의한 영향은 크지 않으며 마이크로파 유전 특성은 주로 각 조성의 혼합 체적비에 의해 결정되는 것으로 보인다.

그림 1(c)는 $MgTiO_3$ 양에 따른 공진주파수의 온도계수의

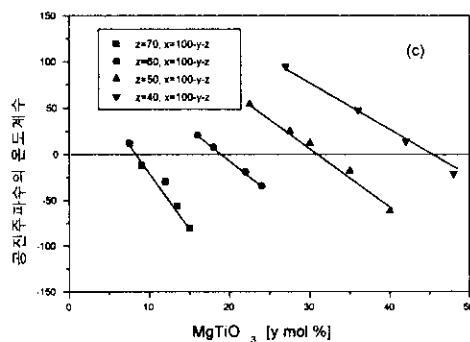
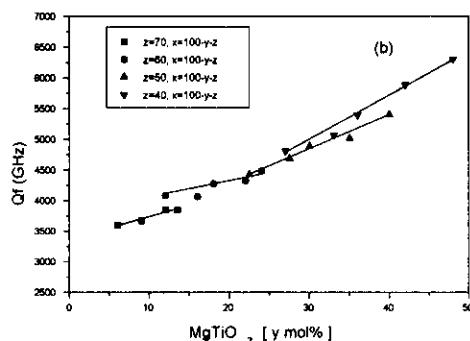
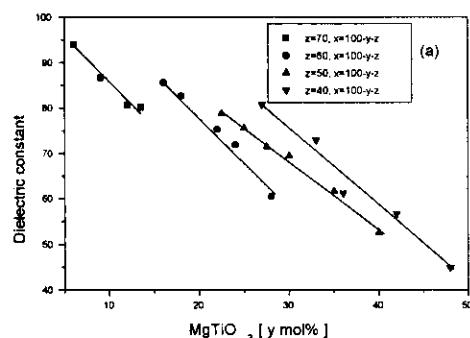


그림 1. 1350 $^{\circ}C$, 2시간 소결한 시편의 $MgTiO_3$ 양에 따른 유전 특성의 변화

(a) 유전 상수

(b) $Q \cdot f$ 값

(c) 공진주파수의 온도계수

변화를 나타낸 것으로, 양(+)의 은도계수를 갖는 CaTiO₃ ($\tau_f = +800$ ppm/°C)와 음(-)인 (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃ ($\tau_f = -274$ ppm/°C), MgTiO₃ ($\tau_f = -45$ ppm/°C)를 혼합하였으므로, MgTiO₃와 (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃의 양이 증가함에 따라 양(+)의 값에서 음(-)의 값으로 변화하게 된다. 특히 공진주파수의 은도계수가 0 ppm/°C인 조성은 (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃의 양이 감소함에 따라 더욱 많은 몰비의 MgTiO₃를 요구하고 있음을 알 수 있다.

3.2 소결 온도에 따른 유전 특성의 변화

그림 2는 그림 1(c)로부터 실제 용용 가능성이 있는 것으로 판단되는, 즉 온도 변화에 안정한 조성들에 대한 xCaTiO₃-yMgTiO₃-z(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃의 소결 온도에 따른 유전 특성의 변화를 나타낸 것이다. 그림 2(a)는 소결 온도에 대한 유전율의 변화를 나타내었고, 그림 2(b)는 소결 온도에 대한 Q·f 값의 변화를 나타낸 것이다. 1250°C에서 1350°C 사이에서는 소결 온도가 증가함에 따라 유전율은 점차 감소하며, Q·f 값은 약간 증가함을 보이고는 있으나 대부분 넓은 소결 온도 범위에서 비교적 고른 유전 특성을 나타내고 있어 실제 용용시 안정된 생산 공정을 유지하기에 유리한 조건을 갖고 있다.

3.3 XRD 결과

그림 3(A)는 (Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃가 50(mol%)로 일정할 때, CaTiO₃와 MgTiO₃ 양의 변화에 따른 XRD 패턴을 나타낸 것이다. 혼합 비율에 따라 강도의 변화가 나타나다가 x=25, y=25, z=50 인 경우, 다른 조성에서는 보이지 않았던 이차상으로 보이는 peak가 발견되었다. 이 peak는 앞서 혼합상으로 생각되었던 이 조성이 단순한 혼합상이 아님을 보여주는 것이다. 그림 4(B)는 이 peak를 규명하기 위한 XRD 분석 결과로서 CaTiO₃와 MgTiO₃의 조성을 일정하게 유지하면서 그 양을 증가시켜가며 측정한 것이다. 이 결과를 통하여 그림 4(B)의 (d),(e),(f) 및 (g)에서 이차상이 발견되고 아울러 점차 peak의 강도가 커짐을 볼 수 있다. 따라서 이차상은 CaTiO₃와 MgTiO₃에 기인된 것으로 보이며, 보다 세밀한 분석은 미세구조 관찰 등의 분석이 향후 이뤄져야 할 것으로 판단된다.

IV. 결 론

본 논문에서는 xCaTiO₃-yMgTiO₃-z(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃ 계 유전체의 각 조성비 및 소결 온도에 대한 마이크로파 유전 특성을 조사하였다. 이 유전체 재료는 유전특성면

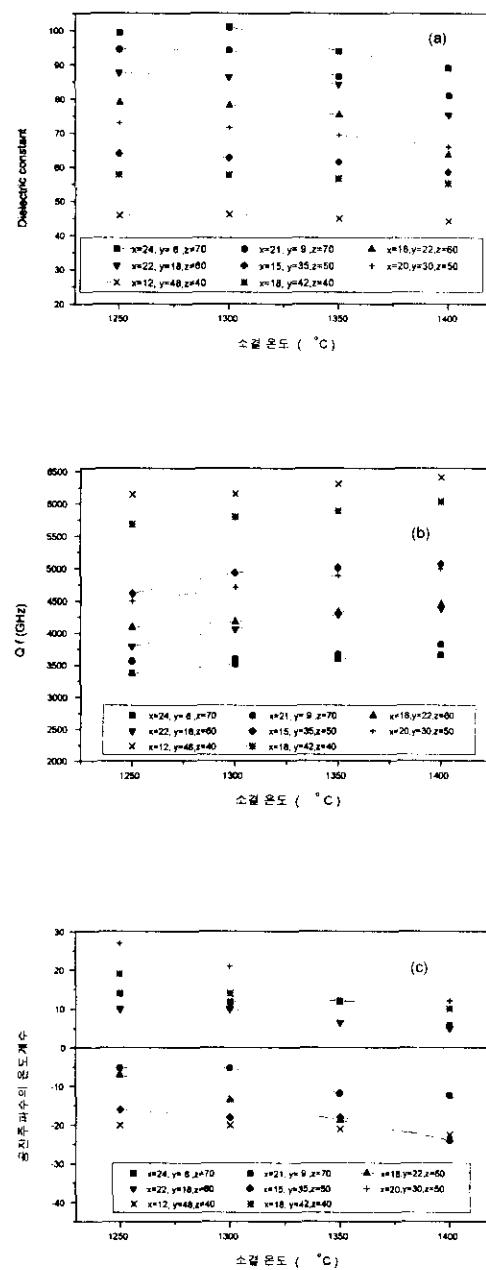


그림 2. xCaTiO₃-yMgTiO₃-z(Li_{1/2}Nd_{1/2})TiO₃의

소결 온도에 대한 유전 특성의 변화

(a) 유전상수

(b) Q·f 값

(c) 공진주파수의 온도계수

참 고 문 헌

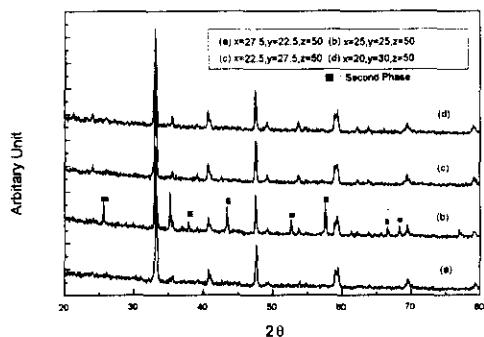


그림 3(A). $(\text{Li}_{1-x}\text{Nd}_x)\text{TiO}_3$ 가 50(mol%)인 경우, CaTiO_3 와 MgTiO_3 양의 변화에 따른 XRD Pattern

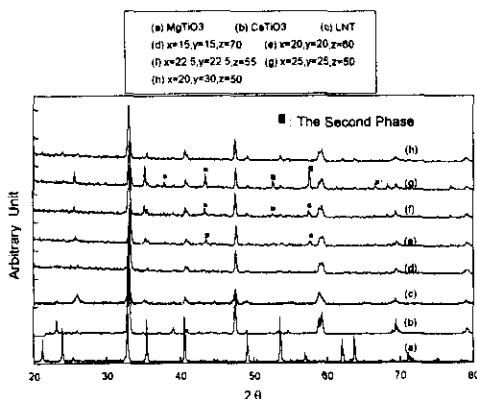


그림 3(B). $\text{CaTiO}_3 : \text{MgTiO}_3 = 1 : 1$ 인 경우의 XRD Pattern

면에서 상호 보상 효과를 갖는 특성을 보여주었다. 이 조성은 조성비 및 소결온도에 따라 유전율(80~90), $Q \cdot f$ ($>4,000$ GHz) 및 $0 \text{ ppm}/\text{°C}$ 에 가까운 공진주파수의 온도계수($<10 \text{ ppm}/\text{°C}$)를 지니고 있어, 유전체를 이용한 통신 부품용 재료로서 적합한 특성을 보였으며, 향후 dopant를 침가해 봄으로써 보다 좋은 유전 특성을 얻을 수 있으리라 기대된다. 그리고 XRD 분석 결과에서 보았듯이 CaTiO_3 와 MgTiO_3 에 의해 기인하는 것으로 보이는 이차상에 대한 연구는 향후 세밀한 분석이 요구된다.

- [1] A. G. Cokbain and P. J. Harrop, "The temperature coefficient of capacitance," *Brit. J. Appl. Phys. (J. Phys. D)*, Ser. 2, vol. 1, pp 1109~1115, 1968.
- [2] M. Takata and K. Kageyama, "Microwave characteristics of $A(\text{B}^{3+})_{1/2}\text{B}^{5+}_{1/2}\text{O}_3$ ceramics [$A=\text{Ba}, \text{Ca}, \text{Sr}$; $\text{B}^3=\text{La}, \text{Nd}, \text{Sm}, \text{Yb}$; $\text{B}^5=\text{Nb}, \text{Ta}$]," *J. Am. Ceram. Soc.*, vol. 72, no. 10, pp 1955~1959, 1989.
- [3] K. Tatsuki, K. Murano, T. Kawamura, H. Kato, S. Yano and S. Nishigaki, "Dielectric properties of $\text{PbO}-\text{ZrO}_2-\text{REO}_x$ ceramics at microwave frequencies," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 26, Suppl. 26-2, pp. 80~82, 1991.
- [4] R.C. Kell, A.C. Greenham and G.C.E. Olds, "High permittivity temperature-stable ceramic dielectrics with low microwave loss," *J. Am. Ceram. Soc.*, vol. 56, no. 7, pp 352~354, 1973.
- [5] H. Takahashi, Y. Baba, K. Ezaki, Y. Okamoto, K. Shibata, K. Kuroki, and S. Nakano, "Dielectric characteristics of $(\text{A}^{1+})_{1/2}\text{A}^{3+}_{1/2}\text{TiO}_3$ ceramics at microwave frequencies," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 30, no. 9B, pp 2339~2342, Sep. 1991.
- [6] B.W. Hakki and P.D. Coleman, "A dielectric resonator method of measuring inductive capacitance in the millimeter range," *IRE Trans. Microwave Theory Tech.*, vol. MTT-8, no. 7, pp 402~410, 1960.
- [7] W. E. Courtney, "Analysis and Evaluation of a Method of Measuring the Complex Permittivity and Permeability of Microwave Insulators," *IEEE Trans. Micrpwave Theory Tech.*, vol. MTT-18, no. 8, pp 476~485, 1970.